

I E E E 名古屋支部 学術講演会

講演題目 : **Reliability statistics based on small data sets**

講師 : **Prof. R. Ross**
(Netherlands Defence Academy, NL)

日時 : 2007年11月9日 (金)
13:30 - 15:00

会場 : 豊橋技術科学大学 A2-301 講義室
(愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘 1-1)
<http://www.tut.ac.jp/intr/in01/in0114/index.html>

[講演内容]

Small data sets from e.g. limited tests yield (far) too optimistic impressions of product reliability. This lecture explains why, provides equations and illustrates this effect numerically.

データ数が少なくしか取れない場合に統計的に如何に取り扱うのが良いのかに関して I E C ・ I E E E 規格 (IEC 62399 Ed. 1.0: IEEE Guide for the Statistical Analysis of Electrical Insulation Breakdown Data (IEEE Std 930 - 2004)) にもなっている内容を分かりやすく話していただく予定です。

連絡先 : 豊橋技術科学大学電気電子工学系 長尾雅行
〒441-8580 愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘 1 - 1
TEL : 0532-44-6725 E-mail : nagao@tut.ac.jp